

Anmeldung für eine Tagungsteilnahme

Bitte bis zum 10.09.2009 faxen an
(030) 63 92-65 01



Name _____

Vorname _____ Titel _____

Firma/Einrichtung _____

Adresse _____

Telefon _____ Fax _____

E-Mail _____

Vortrag ja nein Poster ja nein

Titel des Vortrages / Posters (eine Kurzfassung des Beitrages mit Angabe der Co-Autoren und der zugehörigen Firmen / Einrichtungen bitte beifügen)

Teilnahmegebühren

110,00 € bei Überweisung bis zum 30.09.2009, Studenten 20,00 €
160,00 € bei späterer Überweisung an:
IAP e.V. · Konto-Nr. 553 24 86 00 · Deutsche Bank AG Berlin · BLZ 100 700 00

Anmeldung von Ausstellungsfläche

4 m² 6 m² 8 m²

Miete 60,00 €/m² bei Überweisung bis zum 30.09.2009,
85,00 € bei späterer Überweisung.

Ein Vertreter des Ausstellers nimmt gebührenfrei an der Tagung teil.

Hotelreservierung

zu Vorzugspreisen von 63,00 € für ein EZ plus 12,00 € Frühstück

EZ DZ vom _____ bis _____

Ort, Datum

Unterschrift

Veranstalter

VDI/VDE – Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA);
VDI-Bezirksgruppe Adlershof;
Optec Berlin-Brandenburg e.V.;
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.;
IfG – Institute for Scientific Instruments GmbH
FhG-IZM (Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und Mikrointegration), Berlin;
TSB – Technologiestiftung, Berlin
Geschäftsstelle Adlershof;
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, Berlin;
Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig und Berlin
Technische Universität Berlin
WISTA Management GmbH

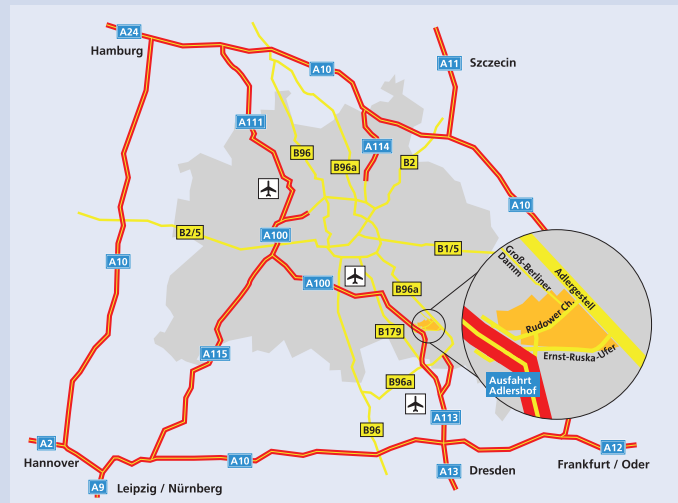
Organisation und Korrespondenzanschrift

Dipl.-Ök. A. Weiß (Organisation)
Tel.: (030) 63 92-65 09
Fr. Ch. Rabe (Sekretariat IAP e. V. und IfG GmbH)
Tel.: (030) 63 92-65 00
IAP Institut für angewandte Photonik e.V.
Rudower Chaussee 29/31
12489 Berlin
Fax: (030) 63 92-6501
E-Mail: info@ifg-adlershof.de

Programmkomitee

E. Auerswald, IZM, Berlin
B. Beckhoff, PTB, Berlin
A. Bjeoumikhov, IfG GmbH, Berlin
F. Burgäzy, Bruker axs GmbH, Karlsruhe
W. Daum, BAM, Berlin
J. Flock, ThyssenKrupp Stahl AG, Duisburg
M. Haschke, Bruker axs Microanalysis GmbH, Berlin
A. Janßen, FH Münster
B. Kanngießner, TU Berlin
M. Krumrey, PTB, Berlin
N. Langhoff, IfG GmbH, Berlin
A. Kharchenko, PANalytical, Almelo, Niederlande
M. Maiwald, BAM, Berlin
H. Miersch, Spectro GmbH & Co. KG, Kleve
U. Panne, BAM und Humboldt-Universität, Berlin
W. Sandner, Max-Born-Institut Berlin
Th. Schüle, Bruker axs Microanalysis GmbH, Berlin
R. Wedell, IAP, Berlin
J. Wiesmann, Incoatec GmbH, Geesthacht

Anfahrtsskizzen auch unter www.wista.de



PRORA 2009

Tagungsankündigung

Fachtagung Prozessnahe Röntgenanalytik

26. und 27. November 2009

am WISTA – Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort
Berlin-Adlershof
Einstein-/Newton-Kabinett
Bunsensaal
Rudower Chaussee 17
12489 Berlin



Ziele und Inhalte der Fachtagung



Am 26. und 27. November 2009 wird die Fachtagung PRORA »Prozessnahe Röntgenanalytik« zum 5. Mal am Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof stattfinden. Neben der Tagung ist ebenfalls wieder eine begleitende Geräteausstellung vorgesehen, auf der Hersteller ihre neuesten Produkte präsentieren können.

Ein wichtiger Schwerpunkt der diesjährigen Tagung wird die Anwendung der prozessnahen Röntgenanalytik in der Photovoltaik sein. Damit wird ein besonders in Deutschland vertretener, sich dynamisch entwickelnder Industriezweig angesprochen, der für die zukünftige Energieversorgung der Gesell-

schaft von großer Bedeutung ist. Darüber hinaus sollen natürlich auch andere Industriezweige, wie z. B. die Halbleiterindustrie und die Pharmaindustrie als wichtige Anwendungsfelder der Röntgenanalytik durch Vorträge und Poster vertreten sein. Neben den Vertretern der Industrie, sowohl im Bereich der Anwendung als auch der Herstellung von Röntgenanalytiksystemen und Komponenten, ist auch die Teilnahme von Fachkollegen aus den Bereichen Forschung und Entwicklung mit interessanten Ergebnissen herzlich willkommen. Die Fachtagung PRORA war und bleibt ein Forum der Diskussion von Forschern, Entwicklern, Geräte- und Komponentenherstellern sowie Anwendern auf dem Gebiet der prozessnahen Röntgenanalytik. Auch Studenten und Doktoranden der entsprechenden Fachrichtungen sind wieder herzlich zur Teilnahme an der diesjährigen PRORA eingeladen.

Es wird um die Anmeldung von Beiträgen bis zum 10. September 2009 gebeten. Das Programmkomitee behält sich die Einordnung als Vortrag oder Poster vor, um ausreichend Platz für Diskussionen zu schaffen. Die einzelnen Programmschwerpunkte werden durch eingeladene Vorträge eingeleitet. Für die Vorstellung der Arbeitsgruppe »Analytische Röntgenphysik« von Frau Professor Birgit Kanngießner, TU Berlin, ist ein Satelliten-Workshop am Samstag, dem 28. November 2009, vorgesehen.

Auf dem Workshop sollen der aktuelle Stand der Forschungsarbeiten der Arbeitsgruppe und insbesondere der Ausbau des »BLiX« (Berlin Laboratory for innovative X-ray technologies) vorgestellt und diskutiert werden. Zudem wird es genügend Raum für die Planung und Anregung von neuen Projekten geben. Im Zusammenhang mit diesem Satelliten-Workshop wird auch die Beratung des Stiftungsrats für die Stiftungsprofessur stattfinden. Anmeldungen werden ebenfalls bis zum 10. September 2009 erbeten.

Folgende Schwerpunktthemen sollen auf der Tagung behandelt werden:

Methodische Besonderheiten der Prozessanalytik

- Anforderungen an die Zuverlässigkeit von Geräten
- Steuer- und Auswertesoftware für die Prozessanalytik
- Strahlenschutzmaßnahmen für On-line Röntgenanalytik

Applikationen in der Industrie

- Prozessnahe Analytik für die Herstellung von Solarzellen und in der Halbleiterindustrie
- Röntgenanalytik für die Nanotechnologie
- Kontaminationskontrolle in der Halbleiterindustrie
- Einsatz von Röntgenverfahren in der Lebensmitteltechnologie
- Methodenkombination für die Sicherheitstechnik

Neue röntgenanalytische Methoden (Forschungsvorlauf)

- Ultrakurzzeitröntgendiffraktometrie als Verfahren für die Materialwissenschaft
- Röntgenmikroskopie
- Verfahren zur Dünnschichtanalytik, Partikelanalyse und Grenzflächenanalytik (z. B. GISAXS – Grazing Incidence Small Angle Scattering, SAXS, Röntgenrefraktometrie)

Neue Entwicklungen bei Komponenten für röntgenanalytische Geräte

- Femtosekundenröntgenquellen für die zeitaufgelöste Röntgenanalytik
- Großflächige Detektionssysteme mit hoher Orts- und Zeitauflösung
- Röntgenoptiken für verschiedene analytische Anwendungen